Search Notes			

-	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	-
	10/711,996	CHEN ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	VAN T. PHAM	2627	

:	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	:		
	· ·		
1			
	: :		
	<i>:</i>		
	:		
	:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•		
	:		
	 :		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
		•	
	: •		
	:		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
East (US-PGPUB; USPAT; USOCR;EPO;JPO;DERWENT;IBM_T DB) 369 and 369/53.31, 47. (text search	2/14/2007	VP
only see search history printout).		